

R100: 薄膜厚度探針量測平台

服務項目	薄膜厚度探針量測平台
使用儀器	Veeco DEKTAK 150 Profilometer
檢測方法	薄膜厚度探針量測平台標準操作 程序
服務範圍(內容)	<p>掃描長度範圍： 55mm-200mm</p> <p>每次掃描數據點：最多 12 萬數據點</p> <p>最大晶圓尺寸： 150mm (6 英寸)</p> <p>臺階高度重現性： 6Å on 0.1um step height</p> <p>垂直範圍：標準 524um ；可選 1mm</p> <p>垂直分辨率：最大 1Å (6.55um 垂直範圍下)</p>